

产品概述

● 探针是电测试的接触媒介，为高端精密型电子五金元器件。可用于所有电子电路的导通检查。



产品分类

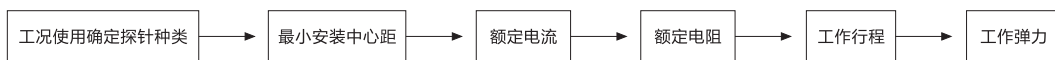
种类	ICT测试用探针	PCB测试用探针	双头探针	整体探针	化成分容探针
特征	ICT适用于行程大、封装了各种集成电路的基板检查。	PCB比ICT用探针便宜，是用于印刷基板单体的检查。	双头探针可配合socket治具，在更为狭窄的安装节距内进行安装测试。	整体型探针无需使用探针座，一体成型。	持续最大电流30A-200A
最大行程(mm)	2.98~20	0.5~6.4	1.1~1.3	3.4~20	9.1~10.5
最小安装中心间距(mm)	1.0~7	0.46~4.8	0.3~1.0	0.8~7	38
外观					

种类	OCV探针	温度探针	高频探针	开关探针
特征	具有快速的响应时间，能够在短时间内完成电压测量。	能够快速响应温度变化，内部为NTC，电阻Beta系数PT100。	支持较宽的频率范围，可承受多次插拔而不损坏，并且在高温、潮湿等恶劣环境下仍能保持良好的性能。	用于部件存在性测试
最大行程(mm)	5~10	16	4	4.0~5.2
最小安装中心间距(mm)	39~76	53.3	53.3	2.54~4.5
外观				

使用安装步骤

1	确定安装位置	根据电路图或测试要求，确定探针需要接触的具体位置。确保这些位置干净无尘，以保证良好的电气接触。
2	固定探针	使用夹具或其他固定装置将探针牢固地安装在测试平台上。确保探针尖端能够准确对准并接触到被测点。
3	连接导线	将探针的引线与测试仪器的输入端正确连接。注意导线的极性和连接方式，避免短路或误接。

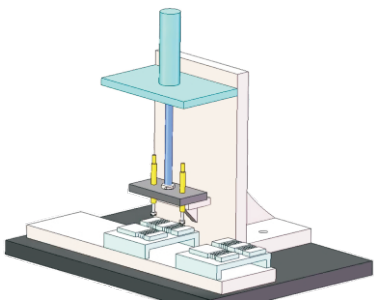
探针的选型



分离式探针安装方式



使用案例



探针是电测试的接触媒介，为高端精密型电子五金元器件，可用于所有电子电路的导通检查。

应用场景：

- 1、印刷电路板测试；
- 2、封装电路板测试；
- 3、半导体测试；
- 4、锂电池性能检测。

使用指南与质保期限

注意事项

工作环境要求

- 工作环境温度应在10~100°C之间，湿度建议不高于30%；
- 周围应无粉尘、腐蚀性气体、油污等可能污染探针的物质。

行程使用条件

- 请仅施加轴向负载，避免任何横向受力；
- 超过推荐行程(全行程的2/3)会显著缩短探针使用寿命；
- 若移动速度超过60次/min(等速运行)，可能影响探针寿命。

电流使用条件

- 请在规定行程内、与触头稳定接触并处于静止状态下通电；
- 若在运动过程中、超出规定行程或未与触头接触(开路)时通电，会大幅缩短探针寿命；
- 探针随时间老化后可能无法达到产品手册标注的容许电流，请在设计中预留充足余量。

电压使用条件

- 请在规定行程内、与触头稳定接触并静止状态下施加电压；
- 请避免在未接触触头(开路)时施加电压。否则，接触瞬间可能产生放电，导致探针损坏；
- 使用高电压时，请严格遵循电流与电压规范，注意防止放电及瞬间大电流。

最大允许电流

- 产品手册中标明的容许电流值为在符合上述条件(环境、行程、电流与电压规范)下，可连续通电1分钟的最大值。

接触电阻

- 手册中提供的电阻值为在标准条件(符合环境、行程与电性能要求)下，通过10mA电流并与纯银端子接触时测得的典型值；
- 电流过大或因触头及内部老化，可能导致电阻升高；
- 多次按规定行程使用后，电阻值可能因部件老化而增大。

建议更换次数

- 产品手册中提供的更换参考次数为在上述标准条件下，探针可正常使用的建议次数；
- 实际使用中如因环境或操作导致电阻显著上升或弹力下降，即使未达参考次数也建议更换，请根据实际情况及时维护。

弹簧压力

- 探针温度如超过80°C，可能导致弹簧压力减弱；
- 电流过大引起发热时，也可能造成弹力下降。

压装安装孔尺寸(参考)

- 所列尺寸为建议值，实际可能因树脂板材质与厚度有所不同，请根据探针底座压装部位的尺寸进行设计。

质保范围

在质保期内，对于正常使用情况下出现的故障，本公司将提供免费维修服务。但以下情况不在质保范围之内：

- (1)由于客户操作不当、安装失误或运输方式不当导致的产品损坏或性能与预期不符；
- (2)订单中的特殊需求(如产品表面处理工艺，特殊温度条件或技术指标等)未在订购时与我方明确沟通并书面确认；
- (3)实际使用环境超出本公司规定的工况范围，如超出允许温度上限、长期接触高温物体或处于腐蚀性环境等。